

Verordnung über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographienverordnung, ToV)

vom 26. April 1993 (Stand am 28. Mai 2002)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf die Artikel 2 Absatz 2, 12 und 18 des Topographengesetzes vom 9. Oktober 1992¹ (ToG) und auf Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995² über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG),³

verordnet:

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zuständigkeit

¹ Der Vollzug der Verwaltungsaufgaben, die sich aus dem ToG ergeben, und der Vollzug dieser Verordnung sind Sache des Instituts für Geistiges Eigentum (Institut).⁴

² Ausgenommen sind der Artikel 12 ToG sowie die Artikel 16–19 dieser Verordnung, deren Vollzug der Eidgenössischen Zollverwaltung obliegt.

Art. 2 Sprache

¹ Eingaben an das Institut⁵ müssen in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst sein.

² Von Beweisurkunden, die nicht in einer Amtssprache abgefasst sind, kann das Institut unter Ansetzung einer Frist eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen; werden die verlangten Unterlagen nicht beigebracht, gelten die Beweisurkunden als nicht eingereicht.

AS 1993 1834

¹ SR 231.2

² SR 172.010.31

³ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 5156).

⁴ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 5156).

⁵ Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 25. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 5156). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt.

Art. 3⁶ Gebühren

Die Gebühren, die nach dem ToG oder nach dieser Verordnung erhoben werden, richten sich nach der Verordnung vom 25. Oktober 1995⁷ über die Gebühren des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum.

2. Abschnitt: Anmeldeverfahren**Art. 4** Mehrere Anmelder und Anmelderinnen

¹ Melden mehrere Personen eine Topographie an, so kann das Institut sie auffordern, eine von ihnen oder eine Drittperson als gemeinsame Vertreterin zu bezeichnen.

² Solange trotz Aufforderung des Institutes keine Vertreterin bezeichnet ist, gilt die in der Anmeldung zuerst genannte Person als Vertreterin.

Art. 5 Unterlagen zur Identifizierung

¹ Folgende Unterlagen sind zur Identifizierung und Veranschaulichung der Topographie zugelassen:

- a. Zeichnungen oder Fotografien von Darstellungen (Layouts) zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses;
- b. Zeichnungen oder Fotografien von Masken oder Maskenteilen zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses;
- c. Zeichnungen oder Fotografien von einzelnen Schichten des Halbleitererzeugnisses.

² Zusätzlich können Datenträger, auf denen in digitalisierter Form Darstellungen einzelner Schichten von Topographien festgehalten sind, oder Computer-Ausdrucke davon sowie die Halbleitererzeugnisse selbst hinterlegt werden.

³ Die Unterlagen sind im Format DIN A4 (21×29,7 cm) oder auf dieses Format gefaltet einzureichen. Grossflächige Zeichnungen, Pläne oder Fotografien, die nicht gefaltet werden können, müssen in Zeichenrollen eingereicht werden, die höchstens 1,5 m lang und 15 cm dick sein dürfen.

Art. 6 Unvollständige Anmeldung

¹ Bei unvollständiger oder mangelhafter Anmeldung räumt das Institut dem Anmelder oder der Anmelderin eine Frist zur Vervollständigung der Anmeldung ein.

² Ist der Mangel nach Ablauf der Frist nicht behoben, tritt das Institut auf die Anmeldung nicht ein.

⁶ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 5156).

⁷ SR 232.148

3. Abschnitt: Das Topographienregister

Art. 7 Registerinhalt

Das Institut trägt die folgenden Angaben in das Register ein:

- a. die Eintragsnummer;
- b. das Anmeldedatum;
- c. der Name oder die Firma sowie die Adresse der anmeldenden Person oder deren Rechtsnachfolgerin;
- d. der Name und die Adresse des Herstellers oder der Herstellerin;
- e. die Bezeichnung der Topographie;
- f. das Datum und der Ort einer allfälligen ersten geschäftlichen Verbreitung der Topographie;
- g.⁸ das Datum der Veröffentlichung;
- h. Änderungen des gewöhnlichen Aufenthaltes oder der geschäftlichen Niederlassung der an der Topographie Berechtigten;
- i. Verfügungsbeschränkungen von Gerichten oder Vollstreckungsbehörden;
- k. das Datum der Löschung.

Art. 8 Aktenheft

Das Institut führt für jede Topographie ein Aktenheft.

Art. 9 Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis

¹ Zu den Akten gegebene Beweisurkunden, die ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert.

² Unterlagen, die nach Artikel 5 zur Identifizierung dienen, dürfen nicht in ihrer Gesamtheit ausgesondert werden.

³ Auf ausgesonderte Urkunden wird im Aktenheft hingewiesen.

⁴ Über die Einsicht in ausgesonderte Urkunden entscheidet das Institut nach Anhörung der an der Topographie Berechtigten, die im Register eingetragen sind.

Art. 10 Bescheinigung

Nach der Eintragung stellt das Institut eine entsprechende Bescheinigung aus.

⁸ Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der Designverordnung vom 8. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2002 (SR 232.121).

Art. 11⁹ Veröffentlichung

¹ Das Institut veröffentlicht die im Register eingetragenen Angaben.

² Es bestimmt das Publikationsorgan.

³ Die Veröffentlichung kann auch in elektronischer Form erfolgen.

⁴ Die elektronische Veröffentlichung ist nur dann massgebend, wenn die Daten ausschliesslich elektronisch veröffentlicht werden.

Art. 12 Änderung und Löschung von Einträgen

¹ Der Antrag auf Änderung von Registereintragungen (Art. 7 Bst. c, h oder i) sowie der Antrag auf vollständige oder teilweise Löschung einer eingetragenen Topographie ist schriftlich einzureichen.

² Für jeden Änderungsantrag muss eine vom Institut in Rechnung gestellte Gebühr bezahlt werden.¹⁰

³ Änderungen, die auf einem vollstreckbaren Gerichtsurteil oder auf einer Vollstreckungsmassnahme beruhen, sowie Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden werden gebührenfrei eingetragen. Es ist eine Kopie des Urteils mit Bescheinigung der Rechtskraft beizufügen.

⁴ Änderungen werden im Aktenheft vorgemerkt, im Register eingetragen und vom Institut bescheinigt.

Art. 13 Berichtigung

¹ Fehlerhafte Eintragungen werden auf Antrag der an der Topographie Berechtigten unverzüglich berichtigt.

² Beruht der Fehler auf einem Versehen des Institutes, so erfolgt die Berichtigung von Amtes wegen.

Art. 14 Registerauszüge

Das Institut erstellt auf Antrag und gegen Gebühr Auszüge aus dem Register.

Art. 15 Aufbewahrung und Rückgabe

¹ Das Institut bewahrt die Akten sowie die hinterlegten Datenträger und Halbleitererzeugnisse nach der gültigen Anmeldung während 20 Jahren auf.

² Werden die Datenträger und Halbleitererzeugnisse nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht zurückverlangt, kann sie das Institut auch ohne Antrag zurückschicken. Kann die Adresse der Berechtigten nicht ausfindig gemacht werden, so werden die hinterlegten Gegenstände zusammen mit den Akten vernichtet.

⁹ Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der Designverordnung vom 8. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2002 (SR **232.121**).

¹⁰ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS **1995** 5156).

4. Abschnitt: Hilfeleistung der Zollverwaltung

Art. 16¹¹ Umfang

Die Hilfeleistung der Zollverwaltung erstreckt sich auf die Ein- und Ausfuhr von Halbleitererzeugnissen, bei denen der Verdacht besteht, dass ihre Verbreitung gegen die in der Schweiz geltende Gesetzgebung über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen verstösst, sowie auf die Lagerung solcher Halbleitererzeugnisse in einem Zolllager.

Art. 17 Antrag auf Hilfeleistung

¹ Die Berechtigten müssen den Antrag auf Hilfeleistung bei der Oberzolldirektion stellen. In dringenden Fällen kann der Antrag unmittelbar beim Zollamt gestellt werden, bei dem verdächtige Halbleitererzeugnisse ein- oder ausgeführt werden sollen.¹²

² Der Antrag gilt während zwei Jahren, wenn er nicht für eine kürzere Geltungsdauer gestellt wird. Er kann erneuert werden.

Art. 18 Zurückbehalten von Halbleitererzeugnissen

¹ Behält das Zollamt Halbleitererzeugnisse zurück, so verwahrt es sie gegen Gebühr selbst oder gibt sie auf Kosten der Antragsteller oder der Antragstellerinnen einer Drittperson in Verwahrung.

² Die Antragsteller oder die Antragstellerinnen sind berechtigt, die zurückbehaltenen Halbleitererzeugnisse zu besichtigen. Die zur Verfügung über die Halbleitererzeugnisse Berechtigten können an der Besichtigung teilnehmen.

³ Steht schon vor Ablauf der Frist nach Artikel 77 Absatz 2 beziehungsweise Absatz 2^{bis} URG fest, dass die Antragsteller oder Antragstellerinnen vorsorgliche Massnahmen nicht erwirken können, so werden die Halbleitererzeugnisse sogleich freigegeben.¹³

Art. 19 Gebühren

Die Gebühren für die Behandlung des Antrags auf Hilfeleistung sowie für die Verwahrung zurückbehaltener Halbleitererzeugnisse richten sich nach der Verordnung vom 22. August 1984¹⁴ über die Gebühren der Zollverwaltung.

¹¹ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Mai 1995, in Kraft seit 1. Juli 1995 (AS 1995 1779).

¹² Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Mai 1995, in Kraft seit 1. Juli 1995 (AS 1995 1779).

¹³ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Mai 1995, in Kraft seit 1. Juli 1995 (AS 1995 1779).

¹⁴ SR 631.152.1

5. Abschnitt: Inkrafttreten**Art. 20**

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1993 in Kraft.